

Interest Groups (Helsinki, March 5, 2010)

1. Electrical impedance tomography

Lassi Päivärinta, **Martin Hanke**, Nuutti Hyvönen, Jin Cheng, Peter Maass, **Jijun Liu**, Andreas Rieder, **Mikko Salo**, Aku Seppänen, Zewen Wang, Samuli Siltanen

2. Sparsity and compressed sensing

Matti Lassas, **Gerd Teschke**, Mikko Kaasalainen, Martin Burger, Peter Maass, **Shuai Lu**, **Samuli Siltanen**, Aku Seppänen, Jijun Liu

3. Transmission eigenvalues and linear sampling

Lassi Päivärinta, Katya Krupchyk, Jijun Liu, **Fuming Ma**, Mikko Salo, **Andreas Kirsch**, Bo Zhang, Nuutti Hyvönen, Martin Hanke

4. Incomplete data CT

Martin Hanke, Matti Lassas, Jin Cheng, **Alfred Louis**, Hai Bing Wang, Thomas Schuster, **Samuli Siltanen**, Sixun Huang, **Jijun Liu**, Andreas Rieder, Juha-Matti Perkkiö

5. Banach and nonlinear regularization

Samuli Siltanen, **Jin Cheng**, **Matti Lassas**, Gerd Teschke, **Bernd Hofmann**, Katya Krupchyk, Thomas Schuster, Peter Maass, Shuai Lu, Juha-Matti Perkkiö, Andreas Rieder, Ting Wei

6. Remote sensing

Gerd Teschke, **Mikko Kaasalainen**, Mikko Orispää, Lassi Roininen, Sari Lasanen, **Wang Yenfei**

7. Approximation and modeling error

Mikko Kaasalainen, Nuutti Hyvönen, **Shuai Lu**, **Aku Seppänen**, **Bernd Hofmann**, Petteri Piironen, Sari Lasanen, Mikko Orispää, Jenni Heino, Juha-Matti Perkkiö

8. Stochastic methods, including the use of Feynman-Kac formulae

Thorsten Hohage, Matti Lassas, **Shuai Lu**, Mikko Orispää, Samuli Siltanen, Petteri Piironen, **Sari Lasanen**, Mikko Kaasalainen, Martin Hanke, Lassi Päivärinta